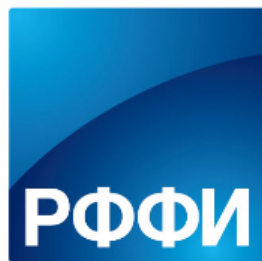


Приём заявок на конкурс «Фундаментальные проблемы структурной диагностики функциональных материалов с применением источников синхротронного излучения с ультрамалым эмиттансом»

Приглашаем учёных СФУ принять участие в [конкурсе](#) Российского фонда фундаментальных исследований на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы структурной диагностики функциональных материалов с применением источников синхротронного излучения с ультрамалым эмиттансом». Приём заявок открыт до 29 августа 2019 года.



РОССИЙСКИЙ
ФОНД
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рубрикатор темы

- 912.1. Фундаментальные основы создания новых элементов источников синхротронного излучения третьего и четвертого поколения, включая узлы линейных и кольцевых ускорителей, методы исследования динамики электронного пучка.
- 912.2. Физические модели компактных систем генерации синхротронного излучения в диапазоне энергий 5-30 кэВ для кольцевых и линейных источников.
- 912.3. Физические основы новых методов формирования когерентных рентгеновских пучков. Исследование возможностей использования этих пучков совместно с излучением лазерных источников.
- 912.4. Новые принципы структурной диагностики слабоупорядоченных биоорганических систем, макромолекул и нанокристаллов в экспериментах на синхротронных и «синхротронно-лазерных» источниках.
- 912.5. Модели экспериментов с временным разрешением для исследования динамики быстропротекающих процессов в функциональных материалах и химических реакций с использованием синхротронного излучения.
- 912.6. Использование динамических дифракционных эффектов в рассеянии когерентного синхротронного излучения для прецизионной структурной диагностики функциональных наносистем.
- 912.7. Исследование функциональных материалов в условиях внешних воздействий и в экстремальных условиях.
- 912.8. Фундаментальные проблемы визуализации внутренней структуры объектов в когерентном пучке синхротронного излучения.
- 912.9. Физические основы новых экспериментальных методов структурной диагностики малых образцов в условиях высокой интенсивности синхротронного излучения и высокого временного разрешения.

Максимальный размер гранта: 4 000 000 рублей в год. Минимальный размер гранта: 2 000 000 рублей в год. Срок реализации проекта: 3 года.

Подача заявки в системе КИАС (с помощью электронной подписи) до **29 августа 2019 года 23:59 (МСК)**.

Для получения информации об актуальных конкурсах просим вас подписаться на

персонализированную рассылку на портале [«Мой СФУ»](#).

За консультациями обращаться:

[Отдел российских грантов и программ СФУ](#), Иванова Анна Андреевна, +7 (391) 206-26-93, 206-26-94, annaivanova [at] sfu-kras [dot] ru, [пр. Свободный, 82А, корпус № 24 \(А\)](#), ауд. 224-1

15 июля 2019 г.

© Сибирский федеральный университет. Редакция сайта: +7 (391) 246-98-60, info@sfu-kras.ru.

Адрес страницы: <https://news.sfu-kras.ru/node/21966>